

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Modification n° 1

Juillet 1985
à la

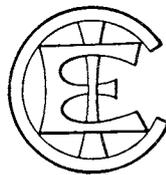
Publication 566
1982

Amendment No. 1

July 1985
to

**Condensateurs destinés à être utilisés dans les circuits de lampes tubulaires
à fluorescence et autres lampes à décharge**

**Capacitors for use in tubular fluorescent
and other discharge lamp circuits**



© CEI 1985

Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

Genève, Suisse

PRÉFACE

La présente modification a été établie par le Sous-Comité 34C: Appareils auxiliaires pour lampes à décharge, du Comité d'Etudes n° 34, de la CEI: Lampes et équipements associés.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
34C(BC)132	34C(BC)138

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-dessus.

Page 10

2. Définitions

Ajouter la nouvelle définition suivante:

2.5 Dérive de la capacité en fonction de la température

La dérive de la capacité en fonction de la température est le taux de variation de la capacité par la température mesurée à la température minimale nominale et à la température maximale nominale. Il est exprimé en pourcentage.

Page 18

11. Ordre des essais

Remplacer les lignes 8 et 9 par ce qui suit:

Le second groupe, comprenant cinq condensateurs, sera soumis aux essais suivants:

- Épreuve de chaleur humide, selon l'article 18.
- Dérive de la capacité en fonction de la température, selon l'article 21.

Page 34

Ajouter le nouvel article suivant:

21. Dérive de la capacité en fonction de la température

21.1 Les mesures de la capacité sont réalisées sous les conditions prescrites à l'article 15.

21.2 La capacité est mesurée successivement à chacune des températures citées ci-après:

- a) $20 \pm 2^\circ\text{C}$
- b) température minimale nominale $\pm 3^\circ\text{C}$ (C_T min.)
- c) $20 \pm 2^\circ\text{C}$
- d) température maximale nominale $\pm 2^\circ\text{C}$ (C_T max.)
- e) $20 \pm 2^\circ\text{C}$

PREFACE

This amendment has been prepared by Sub-Committee 34C: Auxiliaries for Discharge Lamps, of IEC Technical Committee No. 34: Lamps and Related Equipment.

The text of this amendment is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
34C(CO)132	34C(CO)138

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

Page 11**2. Definitions**

Add the following new definition:

2.5 The deviation of capacitance by temperature

The deviation of capacitance by temperature is the rate of change of capacitance with temperature, measured at rated minimum and rated maximum temperature. It is expressed as a percentage.

Page 19**11. Testing sequence**

Replace lines 8 and 9 by the following:

The second group, containing five capacitors, shall be subjected to the following tests:

- Damp heat test in accordance with Clause 18.
- Deviation of capacitance with temperature test in accordance with Clause 21.

Page 35

Add the following new clause:

21. Deviation of capacitance with temperature

21.1 Measurements of capacitance shall be made under the conditions prescribed in Clause 15.

21.2 The capacitor shall be measured at each of the following temperatures in turn:

- a) $20 \pm 2^\circ\text{C}$
- b) rated minimum temperature $\pm 3^\circ\text{C}$ (C_T min.)
- c) $20 \pm 2^\circ\text{C}$
- d) rated maximum temperature $\pm 2^\circ\text{C}$ (C_T max.)
- e) $20 \pm 2^\circ\text{C}$

21.3 Les mesures de capacité sont faites à chacune des températures citées au paragraphe 21.2 après que le condensateur a atteint son régime thermique. La tension de mesure n'est appliquée que durant le temps minimal nécessaire pour l'exécution des mesures de capacité.

La condition de stabilité thermique est considérée comme atteinte lorsque l'écart entre deux mesures de la capacité effectuées à un intervalle d'au moins 5 min n'est pas supérieur à l'erreur pouvant être attribuée à l'appareil de mesure.

Les températures doivent être mesurées avec une précision de $\pm 0,2$ °C.

Il est recommandé au cours des mesures, d'éviter la condensation ou la formation de givre sur la surface des condensateurs.

21.4 La dérive de la capacité en fonction de la température est calculée comme suit:

$$\frac{C_{T \min} - C_o}{C_o} \times 100 \text{ pour la température minimale nominale}$$

$$\frac{C_{T \max} - C_o}{C_o} \times 100 \text{ pour la température maximale nominale}$$

où:

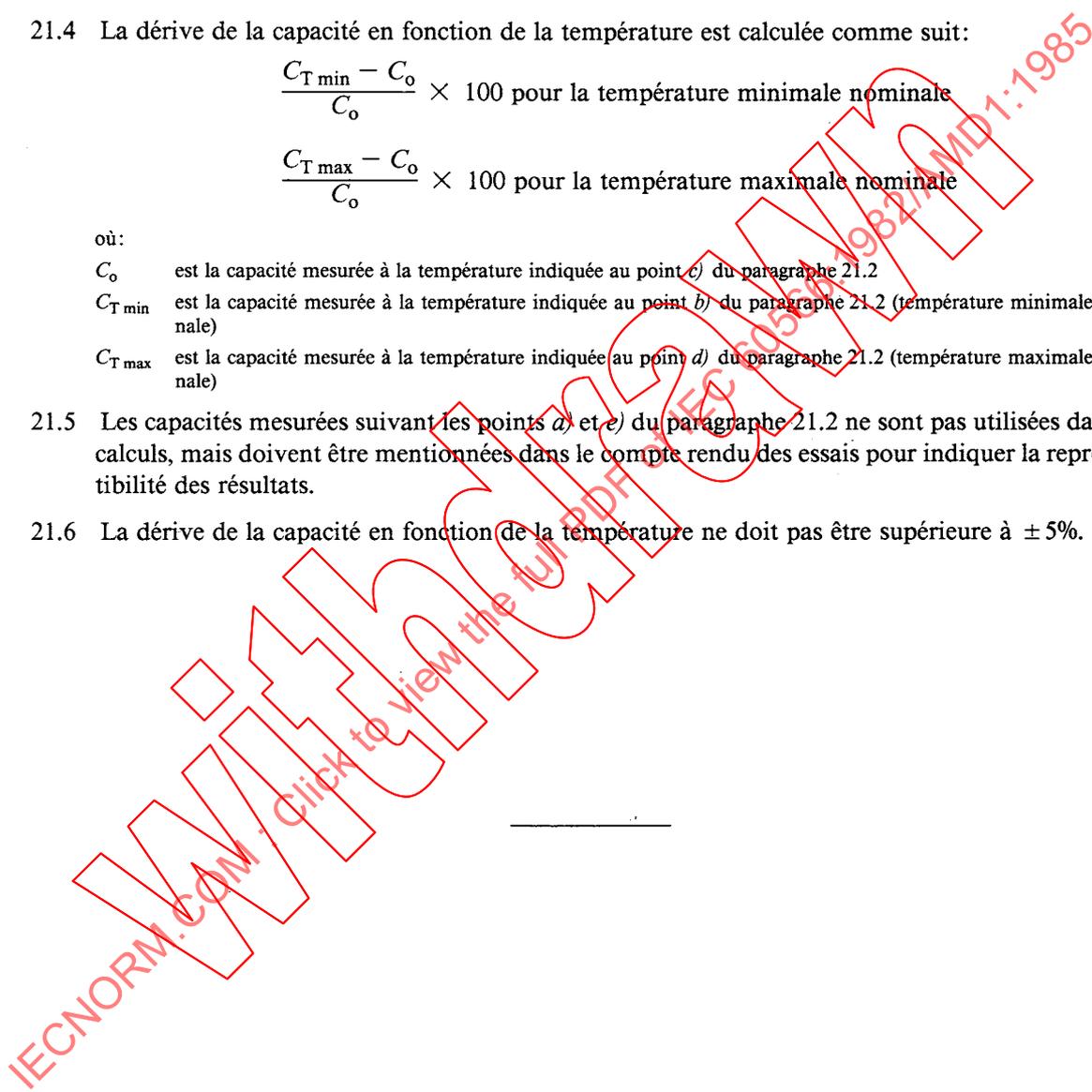
C_o est la capacité mesurée à la température indiquée au point *c*) du paragraphe 21.2

$C_{T \min}$ est la capacité mesurée à la température indiquée au point *b*) du paragraphe 21.2 (température minimale nominale)

$C_{T \max}$ est la capacité mesurée à la température indiquée au point *d*) du paragraphe 21.2 (température maximale nominale)

21.5 Les capacités mesurées suivant les points *a*) et *e*) du paragraphe 21.2 ne sont pas utilisées dans les calculs, mais doivent être mentionnées dans le compte rendu des essais pour indiquer la reproductibilité des résultats.

21.6 La dérive de la capacité en fonction de la température ne doit pas être supérieure à $\pm 5\%$.



- 21.3 Capacitance measurements shall be made at each of the temperatures specified in Sub-clause 21.2 after the capacitor has reached thermal stability. The measuring voltage shall be applied only for the minimum time necessary to make the capacitance measurements.

The condition of thermal stability shall be judged to have been reached when two readings of capacitance taken at an interval of not less than 5 min do not differ by an amount greater than that which can be attributed to the measuring apparatus.

The actual temperature of measurements shall be measured to an accuracy of ± 0.2 °C.

Care should be taken during measurements to avoid condensation of frost on the surface of the capacitors.

- 21.4 The deviation of capacitance with temperature shall be calculated as follows:

$$\frac{C_{T \min} - C_0}{C_0} \times 100 \text{ for the rated minimum temperature}$$

$$\frac{C_{T \max} - C_0}{C_0} \times 100 \text{ for the rated maximum temperature}$$

where:

C_0 is the capacitance measured at the temperature specified in Item *c*) of Sub-clause 21.2

$C_{T \min}$ is the capacitance measured at the temperature specified in Item *b*) of Sub-clause 21.2 (rated minimum temperature)

$C_{T \max}$ is the capacitance measured at the temperature specified in Item *d*) of Sub-clause 21.2 (rated maximum temperature)

- 21.5 The capacitance measured in accordance with Items *a*) and *e*) of Sub-clause 21.2 are not used in the calculation but shall be included in the test report to indicate the reproducibility of the results.

- 21.6 The deviation of capacitance with temperature shall not exceed $\pm 5\%$.

IECNORM.COM . Click to view the full PDF of IEC 60566:1982/AMD1:1985

Withdrawn